

## **Официальный оппонент Голубок А.О.**

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой  
«нанотехнологий и материаловедения»

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский  
университет информационных технологий, механики и оптики»

### Список публикаций по теме диссертации Гущиной Е.В.

1. Комиссаренко Ф.Э., Жуков М.В., Мухин И.С., Голубок А.О., Сидоров А.И. Формирование металлических nanoостровков при электронном облучении тонкой пленки золота на стекле // Журнал технической физики. – 2017. – т. 87. – вып. 2. – С. 306-309.
2. Sapozhnikov I. D., Gorbenko O. M., Felshtyn M. L., Golubok A. O., The combination of scanning electron and scanning probe microscopy / AIP Conference Proceedings. – 2016. V. – 1748. – P. 020004.
3. Zhukov M.V., Lysak V.V., Mukhin I.S., Golubok A.O., High-precision investigation of nanorod and nanosphere topological structures for nanoelectronic issues by means of atomic-force microscopy // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – V. 741. – № 1. – Pp. 1-6
4. Mukhin I.S. , Fadeev I.V., Zhukov M.V., Dubrovskii V.G., Golubok A.O., Framed carbon nanostructures: Synthesis and applications in functional SPM tips // Ultramicroscopy. – 2015. – V. 148. – Pp. 151–157
5. V. V. Levichev, M. V. Zhukov I. S. Mukhin, A. I. Denisyuk, A. O. Golubok, On the operating stability of a scanning force microscope with a nanowisker at the top of the probe // Technical Physics. – 2013. – V. 58. - № 7. – Pp. 1043–1047.
6. Голубок А. О., Пинаев А. Л., Феклистов А. А., Чивилихин С. А., Об устойчивости вольфрамовых зондов при функционировании сканирующего зондового микроскопа в режимах динамической силовой литографии и наноиндентирования // Научно-технический вестник Санкт -

- Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – Вып. 4. - № 74. – стр. 91-97.
7. Голубок А. О., А. Л. Пинаев, Д. С. Чивилихин, С. А. Чивилихини, Динамическая силовая литография на тонких металлических пленках в сканирующем зондовом микроскопе с пьезорезонансным датчиком локального взаимодействия // Научное приборостроение. – 2011. – Т. 21. – №. 1. – с. 31-43.
  8. Голубок А. О., Левичев В. В., Матыжонок В. Н., Стовпяга А. В., Зонд для сканирующей микроскопии токов ионной проводимости // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2010. – Вып. 4. – № 68. – стр. 64-67.
  9. Голубок А.О., Сканирующая зондовая микроскопия, спектроскопия и литография // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2006. – Вып. 30. – стр. 9-17.